ПОРОГОВЫЕ ЗАВИСИМОСТИ В РЕЗОНАНСНОЙ МОДЕЛИ МИКРОЛАЗЕРА НА КВАНТОВЫХ ТОЧКАХ

Юревич Ю.В., Тимощенко Е.В., Пусовская Т.И. Белорусский государственный университет пищевых и химических технологий г. Могилёв, Беларусь

Развитие нанотехнологий позволило создавать так называемые метаматериалы (объекты с оптическими свойствами, отсутствующими у составляющих их веществ). Среди них – объекты, матрица которых включает регулярную структуру квантовых точек (КТ) с относительно высокой концентрацией. КТ обычно представляет область в решётке материала, в которой может происходить локализация носителей заряда (электронов и/или дырок), обладающая столь малыми размерами, что в ней имеет место квантование носителей. Подобный кластер представляет собой островок узкозонного полупроводникового материала, помещенный в более широкозонную матрицу [1]. Первые активные среды из КТ, используемые в лазерах, были созданы на основе In(Ga)As в матрице GaAs. Эти лазеры излучают, в частности, в ИК-диапазоне (~ 1.25... 1.30 мкм) и перспективны для дистанционного контроля состава вредных примесей в атмосфере.

Полупроводниковые КТ, формирующие инверсный слой с квантоворазмерными эффектами. естественным продолжением стали идеи полупроводниковых гетероструктур, сформулированной в начале 60-х годов Ж.И. Алфёровым. КТ удобно моделировать дипольными «мета-атомами», значительно превышающими размер собственно атома, но с наличием дискретной энергетической структуры состояний. Реакция образуемых ими квазикристаллов в наноразмерном планарном формате на резонансное оптическое излучение существенно нелинейна - нелинейность носит низкопороговый характер, поскольку порождена именно резонансным характером взаимодействия поля и среды. Это делает их привлекательными для разработки крайне компактных автоколебательных источников когерентного светового поля, применяемых в нанофотонике и способных излучать без внешних синхронизированных с током накачки модуляторов.

В настоящем сообщении представлены результаты оценки хода пороговых кривых, характеризующих способность микролазеров излучать в режиме автоколебаний. Поле, действующее на активные КТ, в приближении тонкого слоя допускается однородным. Баланс его энергообмена с ансамблем КТ аналогично [2] описывается модифицированной кинетической системой, образованной условиями Максвелла совместно с квантовомеханическими уравнениями Блоха для момента элементарного диполя:

$$\frac{dR}{d\tau} = Ane_i + (\kappa n - 1)(R - \Delta S), \quad \frac{dS}{d\tau} = -(\kappa n - 1)(\beta ne_i - \Delta R - S),$$

$$\frac{1}{\tau_{12}}\frac{dn}{d\tau} = 1 - n - [AR - \beta(\kappa n - 1)S]e_i - \kappa(R^2 + S^2), \quad (1)$$

$$A = 1 - \beta\gamma(\kappa n - 1), \quad \Delta = \gamma - \beta(1 + \gamma^2)\kappa n.$$

Здесь е_i – нормированное световое поле спонтанного излучения, R+iS и n – комплексная амплитуда резонансной поляризуемости и вероятность инверсии, κ – коэффициент усиления, достижимый при данном уровне тока накачки, β – параметр нелинейной рефракции (*Henry factor*), γ – нормирующий коэффициент в локальной поправке (*Lorenz local field*), τ_{12} – отношение характерных времён внутризонной и межзонной релаксации. Нормированная по уровню мощности насыщения усиления выходная мощность лазера в рассматриваемом приближении определяется из выражения:

$$U_{\text{out}} = \{ [\kappa(R - GS) - \gamma\beta(\kappa n - 1)\mathbf{e}_i]^2 + [\kappa(GR + S) - \beta(\kappa n - 1)\mathbf{e}_i]^2 \} / (1 + \gamma^2) , \qquad (2)$$
$$G = \gamma - \beta(1 + \gamma^2) (\kappa n - 1)$$

В отличие от известных аналогов расчёта лазерных систем, где рассматривается присущее резонансному взаимодействию насыщение усиления, схема (1), (2) учитывает типичные для материалов с высокой плотностью дипольных активных центров механизмы резонансной фазовой нелинейности. К ним относится влияние ближних полей диполей на диэлектрическую восприимчивость и резонансная нелинейная рефракция.

Пороговые кривые при условии постоянного уровня тока накачки представляют собой зависимости значений установившейся мощности U_{out} от уровня возбуждения (достижимого коэффициента усиления K). Их определяют из дисперсионных соотношений и стационарных решений, получаемых в сингулярных пределах (1) (индексом *S* отмечены стационарные величины *n*, *R* и *S*, а также *A* и частотной отстройки Δ):

$$\frac{1-n_{s}}{n_{s}} = \frac{A_{s}^{2} + \beta^{2}(\kappa n_{s} - 1)^{2}}{(\kappa n_{s} - 1)^{2}(1 + \Delta_{s}^{2})} e_{i}^{2},$$

$$R_{s} = -\frac{1-\beta(\kappa n_{s} - 1)}{(1 + \Delta_{s}^{2})} \frac{(\gamma + \Delta_{s})}{(\kappa n_{s} - 1)} n_{s} e_{i}, \quad S_{s} = \frac{\beta(\kappa n_{s} - 1)}{(1 + \Delta_{s}^{2})} \frac{(1 - \gamma \Delta_{s}) + \Delta_{s}}{(\kappa n_{s} - 1)} n_{s} e_{i},$$
(3)

Вычисление приведенных на рисунке пороговых зависимостей с учетом фазовых эффектов проводился параметрическим расчетом (2), (3) в диапазоне изменения коэффициентов (1), которые соответствовали их реальным значениям, приведенным в [1].



eta = 0.05 (кривая 1), 0.10 (2) , 0.12 (3), γ = 3.0 (*a*); γ = 2.0 (1), 2.2 (2), 2.5 (3), β = 0.15 (δ); \mathbf{e}_i = 0.025

Рисунок – Пороговые зависимости стационарной выходной мощности лазера

Следует особо отметить, что рассмотрение в (1) - (3) фазовой нелинейности устанавливает реально наблюдаемую особенность поведения пороговых кривых – с ростом тока накачки увеличение выходной мощности выходит на насыщение. В пренебрежении фактором нелинейности при учете только насыщения инверсии в расчетах воспроизводится тривиальная линейная зависимость $U_{out}(\kappa)$ с началом в точке $\kappa = 1.0$.

Список использованных источников

1. Жуков, А.Е. Лазеры и микролазеры на основе квантовых точек. Учебное пособие. / А.Е. Жуков // С.- Пб.: Политехпресс. – 2019. – 42 с.

2. Тимощенко, Е.В. Резонансная модель регулярных режимов излучения лазеров на полупроводниковых квантоворазмерных структурах / Е.В. Тимощенко, В.А. Юревич // 12 Бел. – Росс. Семинар «Полупроводниковые лазеры и системы на их основе»: сборник статей. Минск: ИФ им. Б.И. Степанова НАН Беларуси. – 2019. – С.137-140.